

課題申請システムの 変更点について

高輝度光科学研究センター 利用推進部

2021年11月8日更新

<変更点>

- マイページの一部（トップ画面など）がリニューアルされています。
- 課題申請の内容が一部変更（希望審査分野、装置の選択など）となっており、課題種によって入力項目が異なりますので、下記を参考にしてください。
 - ⇒希望審査分野の選択項目の区分・内容が変更されていますのでご注意ください。
 - ⇒利用を希望される装置を選択していただきます。ビームラインからでも選択が可能です。

課題種	希望審査分野の選択	希望装置・ビームラインの選択
科学審査が免除される課題 (成果専有課題・成果公開優先利用課題 ・測定代行課題・産業利用準備課題など)	無（選択不要）	有
構造生物学分野に関する課題 (結晶構造解析・CryoTEM・溶液散乱) 産業利用分野に関する課題	中・小分類のみ選択	有
上記以外の課題 (一般課題・大学院生提案型課題など)	有	有

課題申請書を新規で作成する場合、ログイン後に『課題申請書を作成・編集する』 → 『新規作成』の順に進む

SACLAマイページに切り替える

課題申請書を作成・編集する

来所前の手続きをする

実験後の手続きをする

採択課題を確認する

研究成果を登録する

マイページトップ / 課題申請書を作成・編集する

SACLAマイページに切り替える

課題申請書を作成・編集する



新規作成

編集

提出済

希望する課題種を選択し、申請情報では該当箇所に
チェックして「次へ」をクリックして進む

Spring-8 SACLA 課題申請/利用計画書 高輝度 太 旧インターフェイスへ切り替える

課題の絞り込み
利用形態
字種分野で利用する
産業分野で利用する
専用ドメインを利用する

該当する課題種別

- ▶ 一般課題 **START** 2021A期課題募集は締め切りました。
【注意】 成果非専有で[1]産業利用分野への申請または成果専有の産業利用(BL14B2、BL19B2、BL46XU)への申請は、下の「一般課題 (産業利用分野)」からお申し込みします。
- ▶ 成果専有 一般課題 **START** 2021A期課題募集は締め切りました。
【注意】 成果非専有で[1]産業利用分野への申請または成果専有の産業利用(BL14B2、BL19B2、BL46XU)への申請は、下の「一般課題 (産業利用分野)」からお申し込みします。
- ▶ 成果公開優先利用課題 **START** 2021A期課題募集は締め切りました。
【注意】 産業利用(BL14B2、BL19B2、BL46XU)以外への申請のみ、産業利用BLへの申請は、下の「成果公開優先利用課題(産業利用分野)」からお申し込みします。
- ▶ 緊急課題 **START**
- ▶ 長期利用課題 **START** 2021A期課題募集はありません。
- ▶ 重点/パートナーユーザー課題 **START**
- ▶ 新分野開拓利用課題 **START**
- ▶ 一般課題 (産業利用分野) **START** 2021A第3期募集中 (BL14B2、BL19B2およびBL46XUのみ) 募集中 (締切:2021年5月10日(月)10:00am)、投期は2021A-IIIを選択してください。
【注意】 成果非専有の場合は、民間企業または産業界に専する機関の方の参加が必須です。また成果専有の産業利用(BL14B2、BL19B2、BL46XU)への申請はこちらからお申し込みします。
- ▶ 成果専有 一般課題 (産業利用分野) **START** 2021A第3期募集中 (BL14B2、BL19B2およびBL46XUのみ) 募集中 (締切:2021年5月10日(月)10:00am)、投期は2021A-IIIを選択してください。
【注意】 成果非専有の場合は、民間企業または産業界に専する機関の方の参加が必須です。また成果専有の産業利用(BL14B2、BL19B2、BL46XU)への申請はこちらからお申し込みします。
- ▶ 成果公開優先利用課題 (産業利用分野) **START** 2021A第3期募集中 (BL14B2、BL19B2およびBL46XUのみ) 募集中 (締切:2021年5月10日(月)10:00am)、投期は2021A-IIIを選択してください。
【注意】 産業利用(BL14B2、BL19B2、BL46XU)への申請のみ。
- ▶ 成果専有 時期指定課題 **START**
- ▶ 成果専有 産業利用率確保課題 **START**
- ▶ 成果専有 測定代行課題 **START**
- ▶ 専用ドメイン **START** 現在、2021A期 受付中。
- ▶ 成果専有 専用ドメイン **START** 現在、2021A期 受付中。

Spring-8 SACLA 課題申請/利用計画書 高輝度 太 さん (ユーザーカード番号: 0000001 / 所属: 高輝度光科学研究センター) 日本語 English マイページ トップ ログアウト

申請情報
未保存 / 一般課題 / 成果非専有 / 実験責任者: 0000001 / 高輝度 太

該当する項目があればチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

申請形式
 新規
 一年 (B期のみ)
 ※「蛋白質結晶構造解析」の課題を申請する場合は、「新規」を選択してください。

蛋白質結晶構造解析 はい

4施設 (Spring-8, SACLA, J-PARC MLF, 「京」/「富士」を含むHPCT) 連携利用 はい

次へ

Spring-8/SACLA User Information System

一般課題、大学院生提案型課題、緊急課題のみ

申請情報

未保存 / 一般課題 / 成果非専有 / 新規
実験責任者: 0000001 / 高輝度 太郎

一時保存

入力内容確認・提出

基本情報

共同実験者

安全に関する記述、対策

提案理由など

実験方法

論文

画像ファイル添付

特殊記号パレット

マイメモ帳

◆ 実験課題名 (日本語) 最大150文字	<input type="text"/>
◆ 実験課題名 (英語) 最大70ワード	<input type="text"/>
希望審査分野・希望ビームライン・装置の選択	
◆ 希望審査分野 (手法)	大分類 <input type="text"/> 中分類 <input type="text"/> 小分類 <input type="text"/>
◆ 希望ビームライン・装置	第1希望 ビームライン <input type="text"/> 装置 <input type="text"/> 第2希望 <input type="text"/> <input type="text"/> 第3希望 <input type="text"/> <input type="text"/>
◆ 研究分野分類	大分類 <input type="text"/> 小分類 <input type="text"/>
サイエンスキーワード 最大50文字	<input type="text"/>
◆ 所要シフト数 [1シフト=8時間]	<input type="text"/> シフト × <input type="text"/> 回 + <input type="text"/> シフト × <input type="text"/> 回 + <input type="text"/> シフト × <input type="text"/> 回 同じシフト数の複数回利用を希望される場合は、例えば「3シフト×2回」と入力してください。 ※「3シフト×1回+3シフト×1回」という入力はできません。
◆ 運転モード ※運転モード選択の説明は こちら	<input type="text"/>
モード希望順位	第1希望 <input type="text"/> 第2希望 <input type="text"/> 第3希望 <input type="text"/> 第4希望 <input type="text"/> 第5希望 <input type="text"/>

※DモードはA期のみ、EモードはB期のみ運転可能です。

クリックすると下記の画面が別ウィンドウで開きます。

希望審査分野・希望ビームライン・装置の選択

大分類 小角・広角散乱
 X線回折 (単結晶)
 X線回折 (粉末)
 X線回折 (汎用・構造評価)
 X線回折 (高圧)

中分類

小分類

装置 希望選択をクリア

[第1希望] ビームラインから選択
 [第2希望] ビームラインから選択
 [第3希望] ビームラインから選択

第1希望 X線散乱測定装置 (40B2)
 大分類: 小角・広角散乱
 主にソフトマターを対象とした小角および広角X線散乱測定を行うことができます。生体高分子や有機高分子などの構造解析に利用されています。
 ビームライン: BL40B2
 担当者: 太田

第2希望 高時間分解X線回折・散乱装置 (40XU)
 大分類: 小角・広角散乱
 高フラックスビームを用いた長時間分解・連続測定の散乱実験を行うことができます。
 ビームライン: BL40XU
 担当者: 関口

第3希望 マイクロドームX線散乱装置 (40XU)

決定 キャンセル

希望審査分野・希望ビームライン・装置の選択

大分類 小角・広角散乱
 X線回折（単結晶）
 X線回折（粉末）
 X線回折（汎用・構造評価）
 X線回折（高圧）

中分類

小分類

必須事項

装置

[第1希望] ビームラインから選択
 [第2希望] ビームラインから選択
 [第3希望] ビームラインから選択

第1希望 X線散乱測定装置（40B2）
 第2希望 大分類：小角・広角散乱
 第3希望 主にソフトマターを対象とした小角および広角X線散乱測定を行うことができます。生体高分子や有機高分子などの構造解析に利用されています。
ビームライン：BL40B2
担当者：太田

第1希望 高時間分解X線回折・散乱装置（40XU）
 第2希望 大分類：小角・広角散乱
 第3希望 高フラックスビームを用いた高時間分解・連続測定の散乱実験を行うことができます。
ビームライン：BL40XU
担当者：関口

第1希望 マイクロドームX線散乱装置(40XU)

< 希望審査分野 >

1. 大分類→中分類→小分類の順に選択してください。
（希望審査分野等の一覧は、[こちら](#)からご確認ください。）
2. 次に、第1希望の装置を選択してください。（第2、第3希望がある場合は、そちらも選択してください）
3. 分類、装置を選択後に、「決定」をクリックすると、基本情報画面に反映されます。



< ビームライン・装置 > 次項参照

大分類で「産業利用」／「人文・社会科学」を選択する場合、希望装置が不明の場合、ビームラインから選択したい場合は、「ビームラインから選択」にチェックし「決定」をクリックしてください。

基本情報画面に戻りますので、希望ビームライン・装置をプルダウンから選択できます。

ビームラインから選択する場合

希望審査分野・希望ビームライン・装置の選択

大分類 小角・広角散乱
X線回折(単結晶)
X線回折(粉末)
X線回折(汎用・構造評価)
X線回折(高圧)

中分類 結晶構造解析
電子密度解析
in-situ operando単結晶回折
格子歪み

小分類 有機系結晶
金属錯体
無機系結晶
MOF

① 審査分野の選択
必須事項

② 該当希望にチェック

第1希望] ビームラインから選択
 第2希望] ビームラインから選択
 第3希望] ビームラインから選択

第1希望 高エネルギーX線構造解析装置 (BL02B1)
大分類: X線回折(単結晶)
汎用的に有機、無機物質の高分解能構造解析を行うことができます。機能性材料の電子密度レベルの精密解析などに利用されています。
ビームライン: BL02B1
担当者: 杉本, 中村唯我

第1希望 汎用型多軸回折計 (BL02B1)
大分類: X線回折(単結晶)
金属・セラミック・有機材料等のX線回折実験を行うことができます。応用測定や各種その場観望実験にも対応可能です。
ビームライン: BL02B1
担当者: 杉本, 中村唯我

第1希望 ポンポイント構造計測装置 (BL40XU)

③ 決定

決定 キャンセル

ビームラインから選択する場合は、「ビームラインから選択」にチェックし、「決定」をクリックしてください。

SPring-8 SACLAR 課題申請/利用計画書 高橋 太郎 さん(ユーザーカード番号: 0000001 / 所属: 高橋光子科学研究センター) 日本語 English マイページ トップ ログアウト

申請情報

一時保存

入力内容確認・提出

基本情報

共同実験者

安全に関する記述・対策

提案理由など

実験方法

希望審査分野 (手法)

大分類 X線回折(単結晶)
中分類 電子密度解析
小分類 金属錯体

希望ビームライン・装置

第1希望	ビームライン	選択してください	装置	選択してください
第2希望		選択してください		選択してください
第3希望		選択してください		選択してください

④ ビームライン・装置をプルダウンから選択できます

注意) 希望される「ビームライン」、「装置」の組み合わせが表示されない場合は「不明、その他」選択し、希望される「ビームライン」、「装置」を電子メールにて事務局までにてご連絡をお願いいたします。

■ 課題申請システムの変更についてのご意見は
こちらからお願いします。

[ご意見フォーム](#)